

PRACTICA N° 4 (INFORME)

MEDICIONES DE LAS CARACTERISTICAS DE DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES

INFORME DE TRABAJO.

I.- En el Marco Teórico, haga un resumen de una página sobre el funcionamiento del osciloscopio en la modalidad X-Y y su aplicación para la observación de curvas características de los dispositivos semiconductores.

II. En la Metodología, describa muy brevemente los procedimientos y circuitos utilizados, indicando los valores nominales de los componentes empleados, las características de las formas de onda aplicadas con el generador de señales y la ubicación de los instrumentos de medición.

III. En los Resultados:

1.- Coloque los datos y gráficos obtenidos en el laboratorio. Complete todas las tablas con los cálculos pertinentes (parámetros bajo medición), incluyendo los errores porcentuales con respecto a los valores indicados por los fabricantes.

IV. En el Análisis de Resultados:

1.- Comente y justifique los resultados obtenidos para los parámetros medidos, indicando si se encuentran o no dentro de los rangos esperados.

V. En las Conclusiones: Escriba sus conclusiones finales sobre la práctica realizada, los procedimientos de medición utilizados y los resultados obtenidos. Haga un breve comentario sobre la aplicabilidad de dichos procedimientos de medición .

VI. En los Comentarios finales: Describa las dificultades que se le presentaron en las etapas de montaje y medición de los circuitos en el laboratorio, analice las causas de los problemas, indique cómo los resolvió y haga un comentario sobre los procesos que debe seguir para tratar de prevenir o evitar dichas dificultades. Evalúe el grado en que Ud. considera que ha alcanzado los objetivos de la práctica.

VII. Recuerde anexar los Pre-Informes de los miembros del grupo.